

Prosilica GE

4000



- 11 Megapixel
- ON Semi KAI-11002 Sensor
- Galvanisch getrennter I/O
- Diverse Objektivanschlüsse

Beschreibung

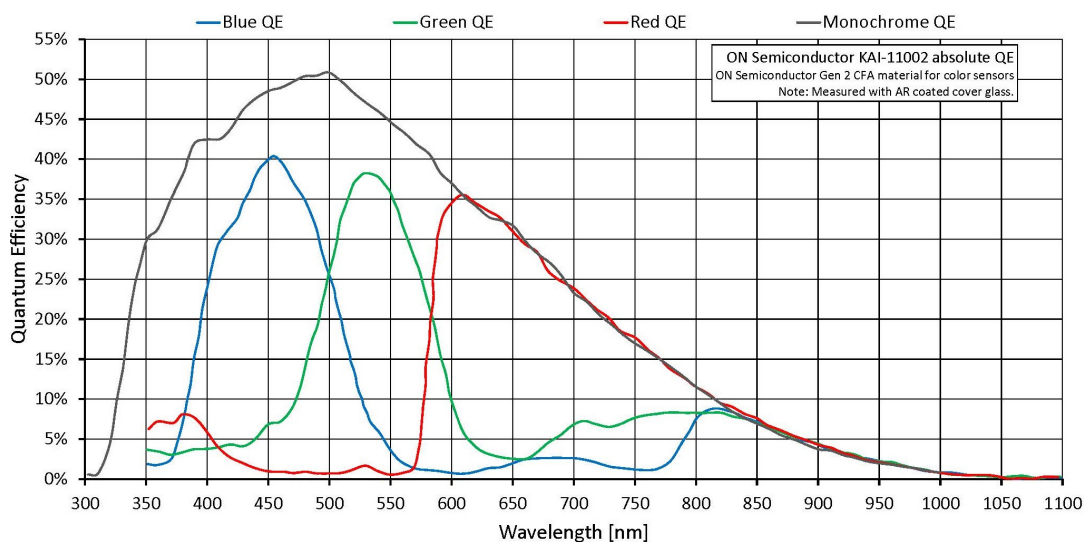
11 Megapixel CCD-Kamera - 5 fps

Die 11 Megapixel-Kamera Prosilica GE4000 ist eine extrem hochauflösende CCD-Kamera mit Gigabit Ethernet Schnittstelle. Ihr Sensor (35 mm-Format, CCD) ist der hochwertige ON Semiconductor KAI-11002, der eine besonders hohe Auflösung, hohe Empfindlichkeit und hohen Dynamikumfang bietet.

Spezifikationen

Prosilica GE	4000
Interface	IEEE 802.3 1000baseT
Auflösung	4008 (H) × 2672 (V)
Sensor	ON Semi KAI-11002
Sensortyp	CCD Progressive
Sensorgroße	Type 35 mm
Pixelgröße	9 µm × 9 µm
Objektivanschluss (Standard)	F-Mount
Max. Framerate (volle Auflösung)	5 fps
ADC	12 bit
Bildzwischenspeicher (RAM)	32 MByte
Output	
Bit-Tiefe	8/12 bit
Monochrome Pixelformate	Mono8, Mono12, Mono12Packed
Raw Pixelformate	BayerGR8, BayerGR12, BayerGR12Packed
General purpose Inputs/Outputs (GPIOs)	
TTL I/Os	1 input, 3 outputs (with galvanic isolation)
RS232	1

Prosilica GE	4000
Betriebsbedingungen/Abmessungen	
Betriebstemperatur	0 °C to +50 °C ambient (without condensation)
Spannungsversorgung	5 to 24 VDC
Leistungsaufnahme	6 W at 12 VDC
Masse	402 g
Abmessungen (L × B × H in mm)	110 × 66 × 66 (inkl. Anschlüsse)
Konformität	2011/65/EU, including amendment 2015/863/EU (RoHS)



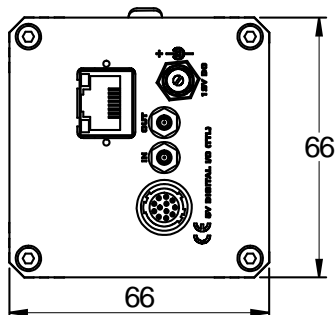
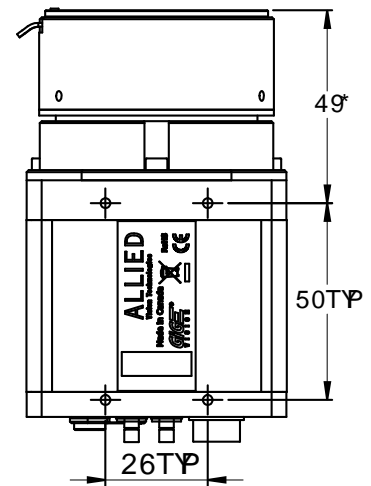
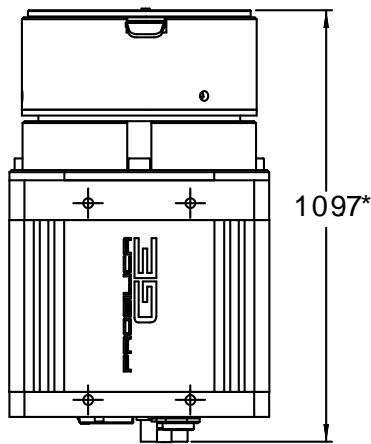
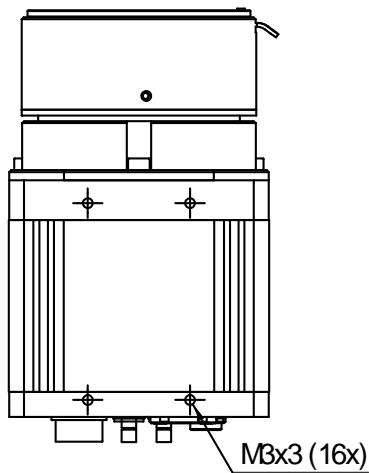
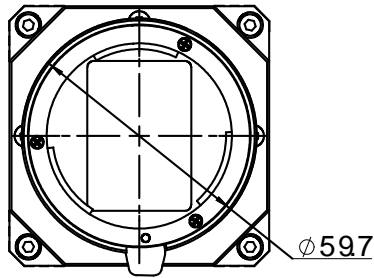
Features

Features der Prosilica GE4000:

- ROI, separates ROI für Auto Features
- Binning
- Auto Gain (manuelle Gainsteuerung: 0 bis 34 dB)
- Auto Belichtung (140 µs bis 68.7 s)
- Auto Weißabgleich
- StreamBytesPerSecond (einfache Bandbreitenkontrolle)
- Stream Hold
- Sync out Modi: Trigger ready, input, exposing, readout, imaging, strobe, GPO
- Event Channel
- Recorder Modus und Multiframe Modus

- Chunk Daten
- Speicherbare Benutzereinstellungen

Technische Zeichnung



* Nominal value. Add 0.3 mm for color cameras.



Applikationen

Die Prosilica GE4000 eignet sich bestens für viele Applikationen, beispielsweise:

- LCD Panel Inspektion
- Halbleiter Wafer Inspektion
- Solar Panel Inspektion
- Luftaufnahmen
- 3D Messtechnik
- Maschinelles Sehen allgemein
- Öffentliche Sicherheit
- Überwachungssysteme
- Verkehrsüberwachung (Intelligent Traffic Systems)
- Embedded Systems
- OEM Applikationen